



Unidad de Calidad e Innovación - Berrikuntza eta Kalitate Unitatea

PROGRAMA DEL CURSO

Título del curso: Fundamentos y aplicaciones de la Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS). Ref. 17106.

Servicio General de Rayos X: Unidad de XPS.

Horario: de 9:00 a 14:00 (de lunes, martes y miércoles) y de 15:30 a 18:00 (lunes y martes).

UNIDAD DIDÁCTICA / PRÁCTICA	HORAS	FECHA	DOCENTE	AULA / LABORATORIO
Introducción. Conceptos básicos.	2.5	02/10/2017	M. Belén Sánchez	Aula por confirmar, de la Facultad de Ciencia y Tecnología
Instrumentación (Cámara de introducción de muestra y cámara de análisis, Fuente de Rayos X, Sistema de lentes y analizador, Detector, Cañón de iones, Cañón de electrones). Aspectos técnicos y visita a las instalaciones.	2.5	02/10/2017	M. Belén Sánchez	Aula por determinar y laboratorio de XPS, Edificio F3P0, Facultad de Ciencia y Tecnología
Ejemplos prácticos: Determinación de la composición química y de los estados de oxidación de muestras problema. Análisis de XPS con resolución angular de muestra problema.	2.5	02/10/2017	M. Belén Sánchez	Laboratorio de XPS, Edificio F3P0, Facultad de Ciencia y Tecnología
Aplicaciones de la técnica	1.5	03/10/2017	M. Belén Sánchez	Aula por confirmar, de la Facultad de Ciencia y Tecnología
Introducción al tratamiento de datos	1	03/10/2017	M. Belén Sánchez	Aula por confirmar, de la Facultad de Ciencia y Tecnología
Ejemplos de tratamientos de datos. Composición química y determinación de los estados de oxidación.	1.5	03/10/2017	M. Belén Sánchez	Aula por confirmar, de la Facultad de Ciencia y Tecnología
Tratamiento de datos por parte de los alumnos	1	03/10/2017	M. Belén Sánchez	Aula por confirmar, de la Facultad de Ciencia y Tecnología
Ejemplo práctico: Análisis de los perfiles de profundidad de la muestra problema. Análisis AES.	2.5	03/10/2017	M. Belén Sánchez	Laboratorio de XPS, Edificio F3P0, Facultad de Ciencia y Tecnología

UCAL.FR.06.PR.13.01 PROGRAMA DEL CURSO

Edición: 02/18.07.2013 Emisión: 28.02.2013



Ikerketa Errektoreordetza



Unidad de Calidad e Innovación - Berrikuntza eta Kalitate Unitatea

Introducción a la Espectroscopía AES. Comparación con XPS, ventajas e inconvenientes.	2	04/10/2017	M. Belén Sánchez	Aula por confirmar, de la Facultad de Ciencia y Tecnología
Radiación sincrotrón.	0.5	04/10/2017	Mª Belén Sánchez	Aula por confirmar, de la Facultad de Ciencia y Tecnología
Ejemplos de tratamientos de datos II. Composición química y determinación de los estados de oxidación. Análisis de perfiles de profundidad.	1.0	04/10/2017	M. Belén Sánchez	Aula por confirmar, de la Facultad de Ciencia y Tecnología
Tratamiento de datos por parte de los alumnos II	1.5	04/10/2017	M. Belén Sánchez	Aula por confirmar, de la Facultad de Ciencia y Tecnología

Emisión: 28.02.2013